

تأثير درجة الحرارة التلدين على الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية أكسيد الزنك النانوية المترسبة بتقنية الليزر النبضي

عثمان مزبان طالب*، قاسم حمادي محمود

قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة تكريت، العراق

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)<https://doi.org/10.54153/sjpas.2023.v5i2.512>

الخلاصة:

تم تحضير أغشية نانوية من أكسيد الزنك (ZnO) بتقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD)، حدث الترسيب للغشاء من خلال التفاعل بين أشعة الليزر الساقطة مع ذرات مادة الهدف ثم تتكون حالة البلازما داخل حجرة الترسيب للأعلى باتجاه قواعد الترسيب المثبتة أعلى من القرص (الهدف) بمسافة (20)mm، وضغط فراغ (10⁻³) mbar تترسب الأغشية وتنمو على سطح قاعدة الكوارتز بحيث تكون المسافة بين مادة الهدف وأشعة الليزر (150 mm)، وحرارة تلدين مختلفة القيم (550,750,950)°C وبزمن ساعتين على شرائح الكوارتز. تمت دراسة تأثير تغير درجات حرارة التلدين على الخصائص التركيبية وطبوغرافية السطح والبصرية والكهربائية باستخدام أجهزة القياسات UV, SIM, AFM, XRD. وذلك لغرض معرفة طبيعة سطح الغشاء المحضر وملاحظة التغير في الحجم الحبيبي مع زيادة درجات حرارة التلدين بعد الترسيب. وجد أن معدل الحجم الحبيبي (42.16) nm، وأن التوجيه التفضيلي على طول السطح (200)، وتقل فجوة الطاقة بزيادة درجات حرارة التلدين لتصبح (3.15) eV عند حرارة تلدين 950°C، وأن الامتصاصية ومعامل الامتصاص تزداد بزيادة حرارة التلدين، تبين من فحص المجهر الإلكتروني الماسح أن Green sise يزداد بزيادة الحرارة للأغشية وأن كل العينات nanoparticles وأن العناصر التي يتكون منها الغشاء هي الزنك و O التي وضحاها فحص مطياف التشتت للطاقة بالأشعة السينية (EDX). وأظهرت فحوصات ظاهرة تأثير هول للعينات أنها من النوع السالب وأن التوصيلية ومعامل هول والتحريرية الكهربائية تزداد بزيادة حرارة التلدين.

معلومات البحث:

تاريخ الاستلام: 2023/03/27

تاريخ القبول: 2023/04/30

الكلمات المفتاحية:

الأكاسيد، ترسيب بطريقة (PLD)،

شرائح كوارتز، Films Thin، التلدين

معلومات المؤلف

الايمل:

mzbantman314@gmail.com

المقدمة

أكسيد الزنك مركب لا عضوي ذو الاسم الكيميائي ZnO وهو مسحوق أبيض غير ذائب في الماء، وهو شبه موصل كثير الاستعمال في مجالات مختلفة مثل النبائط الإلكترونية والأجهزة الضوئية والتحفيز السمعي، ويستخدم أيضاً كمادة مساعدة إلى العديد من المنتجات بما فيها الترانزستورات والدايودات. كذلك المستحضرات والمراهم الطبية، والبطاريات الكهربائية.

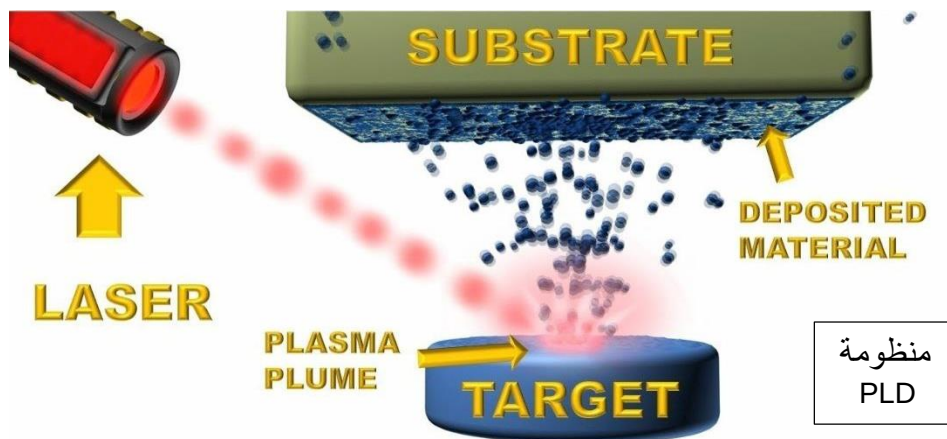
وهي مادة جيدة ذات مواصفات كثيرة ومناسبة للتقنيات العالية مثل الثنائيات الباعثة، وأجهزة الكشف السمعية، وأجهزة التحسس. وزاد الاهتمام بأكسيد الزنك النانوي لما له من خصائص تمكنه من دخول العديد من المجالات والتطبيقات حيث يتميز بالقوة العالية، وخفة الوزن، صغر الحجم وكذلك التفاعل الكيميائي الجيد، [1] وفي التطبيقات الحيوية [2]، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضير ZnO NPs بما في ذلك الطرق الفيزيائية والكيميائية مثل البخار الحراري، ترسيب التبخير الكيميائي، ترسيب البخار الفيزيائي، التحلل الحراري بالرش، وطريقة ترسيب (Sol-gel)، الترسيب الكهروكيميائي، وطريقة الاستئصال بالليزر النبضي [3]. وبالنظر لرقعة طبقة الأغشية الرقيقة فإنها تترسب على قواعد من الزجاج أو الكوارتز أو السيليكون وغيرها من قواعد الترسيب حسب الحاجة العلمية أو التطبيق المطلوب للبحث أو الدراسة [4]، حيث أن الخصائص الفيزيائية للغشاء الرقيق تختلف عن خصائص المواد الأساسية التي تكونت منها وهي في الحالة الحجمية [5].

وتوجد تقنيات كثيرة لترسيب الاغشية الانا في هذا البحث سنستخدم تقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD) لما تتصف به من مزايا كثيرة [7][6] منها ان مصدر الليزر خارج الحجرة وبذلك يكون الغشاء النامي اقل تلوثاً، ويمكن التحكم بطاقة الليزر وعدد النبضات وزاوية السقوط وضغط الحجرة، وان الاغشية المحضرة ذات نوعية عالية ويمكن تحضير أكبر عدد منها بوقت قياسي وانها من التقنيات الرخيصة نسبياً وتحضيرات الهدف وقواعد الترسيب سهلة وغير معقدة.

ان الاغشية المحضرة بتقنية الترسيب بالليزر النبضي جعلت من هذه الاغشية مُعدة لصناعة متحسس غازي للكشف عن الغازات السامة والدخان وللكشف عن تسرب غاز الفريون بزمان استجابة قليل نسبياً أفضل من التقنيات الاخرى لمادة اوكسيد الزنك ذو البلورات المتعددة كدالة لدرجات حرارة التلدين.

وتتجلى اهمية هذا البحث بمعرفة أفضل الخصائص للأغشية وفي اي درجة حرارة تلدين يمكن ان تؤدي أحسن النتائج باستخدام اغشية اوكسيد الخارصين كمتحسس غازي.

الجزء التجريبي : تم تحضير اقراص مادة الهدف من مسحوق اوكسيد الخارصين النانوي ذو نقاوة (99.9) والمصنع من شركة SKY SPRING NANOMATERIAL الأمريكية حيث تم استعمال ميزان دقيق حساس من شركة - Mettler A.K 160 أذ تبلغ حساسيته (gr 10^{-5}) وزن 3g) وكبسها بمكبس هيدروليكي بقوة 8 KN في قوالب خاصة يكون القطر الداخلي لل قالب 1.2 cm، وتم تلدين القرص بفرن حراري بدرجه 400°C ، تُحضر الاغشية الرقيقة لمادة اوكسيد الخارصين (ZnO) بتقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD) بطاقة ليزر 700 mJ وعدد نبضات 650 pulse وتردد 7 Hz وضغط تفريغ mbar (10^{-3}) وتم تنظيف شرائح الكوارتز يدوياً بالكحول ومن ثم بالماء المقطر لمدة 10 دقائق وتم تجفيفها والبدء بعملية الترسيب. ويحدث الترسيب للغشاء من خلال التفاعل بين اشعة الليزر من المسدد مع ذرات مادة اوكسيد الزنك فتتكون حالة البلازما داخل الحجرة للأعلى باتجاه قواعد الترسيب المثبتة اعلى من القرص (الهدف) بمسافة 20mm، (10^{-3} mbar) تترسب الاغشية وتنمو على سطح قاعدة الكوارتز بحيث تكون المسافة بين مادة الهدف واشعة الليزر (150 mm)، بعد ذلك يتم تلدين الغشاء بفرن حراري ولمدة ساعتين بجو من الاوكسجين، ودرجات حرارة مختلفة القيم $550, 750, 950^{\circ}\text{C}$ ومن فوائد التلدين [8] العمل على التقليل من العيوب البلورية واعادة ترتيب التركيب البلوري للمادة ويمكن التلدين من ازالة بعض المستويات الموضعية داخل فجوة الطاقة، وتم قياس سُمك الاغشية بطريقة التداخل البصري وفق العلاقة $t = \Delta X / X \times \lambda / 2$. والشكل (1) يبين مخطط توضيحي لمنظومة الترسيب بالليزر النبضي.

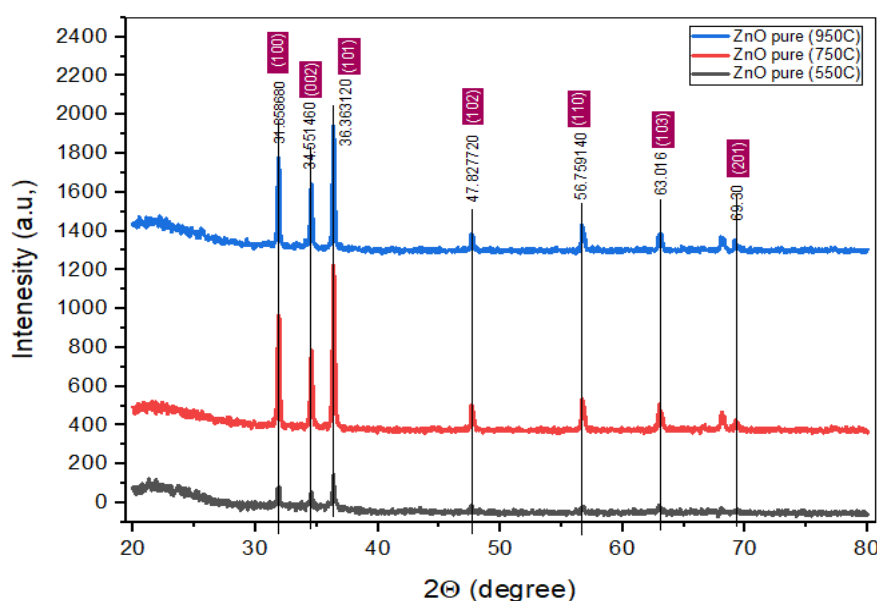


الشكل 1: مخطط يوضح منظومة الترسيب بالليزر النبضي (PLD).

الاجهزة المستخدمة

تم دراسة وتحليل النتائج من جهاز المطياف (UV) من نوع (UV/visible sp – 8001 spectrophotometer) لتحديد الامتصاصية وفجوة الطاقة، وتم دراسة طبيعة السطح للنماذج المُرسبة من نتائج فحوصات مجهر القوة الذرية (AFM) (type AA 3000) المصنوع من شركة (Angstrom Advanced Company)، وتم تحليل صور المجهر الالكتروني الماسح (SEM) للتعرف على البنية البلورية للأغشية الرقيقة المحضرة وتم الفحص بجهاز حيود الاشعة السينية (XRD) ذي المواصفات 1.5A° , voltage 40 kv, Current 30 mA. وتم دراسة نتائج فحص تأثير ظاهرة هول لمعرفة نوع شبه الموصل ومعرفة نوع الحاملات وتركيزها اضافة الى التحركية والموصلية الكهربائية

حيود الأشعة السينية: أظهر حيود الأشعة السينية (XRD) للعينات المترسبة المحضرة من ZnO النانوي المرسب على شرائح من الكوارتز بواسطة الليزر النبضي (PLD) لعدد من العينات المختلفة بدرجات حرارة التلدين وتتراوح بين $550, 750, 950^{\circ}\text{C}$ تركيباً ذو بلورات متعددة حيث ظهرت لدينا سبعة قمم على الترتيب (101), (002), (100) $\Theta = 69.30$ على التوالي، وتم مقارنتها مع الملف القياسي العالمي لأوكسيد الزنك وكانت النتائج تتفق مع البطاقة (01-079-0206) ويحتوي على تركيب هندسي سداسي النظام ($\alpha = 90^{\circ}$), ($\beta = 120^{\circ}$), ($\gamma = 90^{\circ}$) (Hexagonal) ويوضح الشكل (2) تأثير زيادة درجة حرارة التلدين على الخواص التركيبية للأغشية الرقيقة، وتبين من الرسم (2) زيادة في حدة القمم (100)، (002)، (101) عندما تزداد درجة حرارة التلدين أصبحت حادة أكثر مما كانت عليه عند درجة التلدين الأقل ويعود السبب في ذلك إلى تحسن تبلور غشاء ZnO الرقيق مع هذه الزيادة بدرجة حرارة التلدين، وجد أيضاً أن عرض المنحني لمنتصف الشدة (FWHM) يقل مع زيادة درجة حرارة التلدين كما في الجدول (1) وتفسير هذا حسب معادلة دي - باي شرر ($G.S = k$) $(\lambda/B \cos \theta)$ فان نقصان B عرض المنحني لمنتصف القمة سوف يزداد الحجم الحبيبي وتزداد كثافة ذروة الحيود تبعاً لذلك ويعود السبب في ذلك إلى التحسن في التبلور للأغشية الرقيقة المحضرة من ZnO وهذه تشابه نتائج البحث [9].



الشكل 2: يبين حيود الأشعة السينية (XRD) لعينات ZnO بدرجات حرارة تلدين $550, 750, 950^{\circ}\text{C}$.

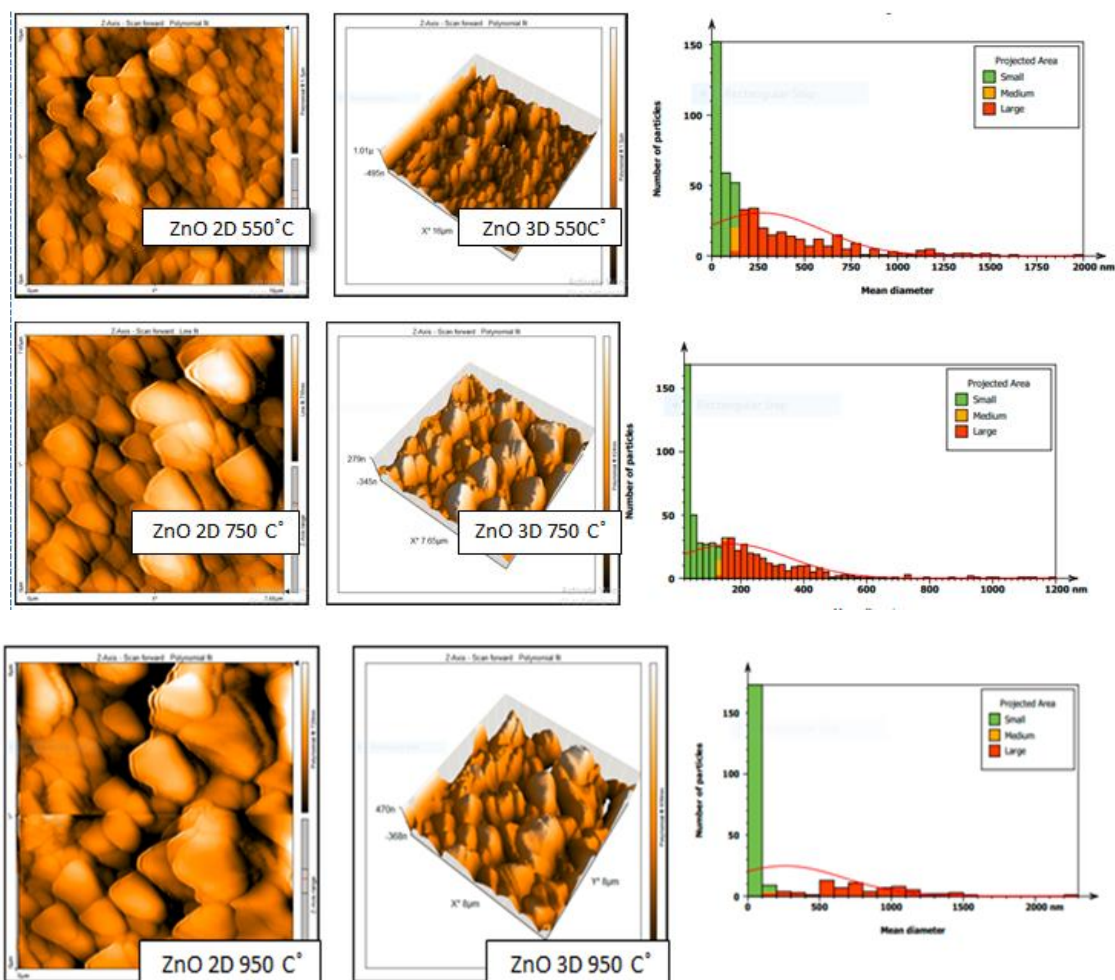
الجدول 1: يبين نتائج فحوصات (XRD) لعينات من مادة ZnO بحرارة تلدين $550, 550, 950^{\circ}\text{C}$.

Sample	Formula	2 θ (deg) Exp.	2 θ - Standar	d(Å)	Intensity	FWHM	(hkl)	System	D (nm) G.S
ZnO Annealing 550 °C	ZnO nano.	31.85	31.765	2.80	84.23	0.196	100	Hexagonal	38.80
		34.55	34.42	2.59	86.53	0.157	002	Hexagonal	48.16
		36.35	36.25	2.47	179.61	0.157	101	Hexagonal	47.92
		47.63	47.53	1.90	38.93	0.118	102	Hexagonal	61.52
		56.74	56.59	1.62	24.30	0.314	110	Hexagonal	22.15
		62.97	62.85	1.47	31.36	0.263	103	Hexagonal	28.67
		69.30	69.16	1.38	13.12	0.402	201	Hexagonal	15.40
ZnO Annealing 750 °C	ZnO nano.	31.88	31.67	2.80	266.5	0.157	100	Hexagonal	48.49
		34.55	34.42	2.59	488.9	0.157	002	Hexagonal	48.16
		36.37	36.25	2.46	844.9	0.196	101	Hexagonal	38.33
		47.64	47.53	1.90	128.8	0.190	102	Hexagonal	36.91
		56.70	56.59	1.62	149.0	0.157	110	Hexagonal	44.38
		62.95	62.85	1.47	117.2	0.157	103	Hexagonal	43.01
		69.30	69.16	1.38	13.12	0.402	201	Hexagonal	15.40
ZnO Annealing 950 °C	ZnO nano.	31.88	31.76	2.80	453.0	0.157	100	Hexagonal	48.49
		34.53	34.42	2.59	303.3	0.157	002	Hexagonal	48.16
		36.36	36.25	2.47	627.4	0.196	101	Hexagonal	38.38
		47.16	47.53	1.90	76.3	0.263	102	Hexagonal	30.76
		56.67	56.59	1.62	132.5	0.157	110	Hexagonal	44.39
		62.79	62.85	1.47	76.62	0.144	103	Hexagonal	47.02
		69.30	69.16	1.38	13.12	0.402	201	Hexagonal	15.40

وتم اختيار (Θ) القياسية التي تقابل أعلى ذروة لمادة (ZnO) في القيم التي ظهرت في فحص (XRD).

الخواص التركيبية - مجهر القوة الذرية

تم استخدام مجهر القوة الذرية (AFM) لدراسة طبيعة السطح لأغشية ZnO المُحضرة على قواعد من الكوارتز بدرجات حرارة تليدين مختلفة ومن الشكل (3) تبين زيادة في الحجم الحبيبي كما تثبتته البيانات في الجدول رقم (2) الذي يبين ازدياد في الجذر التربيعي لمتوسط الارتفاع (Rq) وزيادة في معدل خشونة السطح (Ra) مع زيادة حرارة التليدين، ويدل هذا على ان كلما زاد معدل الجذر التربيعي تكبر تبعاً لذلك الخشونة السطحية للغشاء ويفسر خشونة السطح ومما يؤكد كبر حجم الحبيبات بفعل التليدين وكبرها يفسر ان السطح ذو ترتيب كثيف، وهذه النتائج تتطابق مع ما توصل اليه الباحث [10] وأضيف في البحث عدد الجسيمات النانوية لوحدة الحجم. وهذا يفسر حصول الانماء البلوري وتحسن مواصفات الغشاء بزيادة حرارة التليدين .



شكل (3) صور مجهر القوة الذرية (AFM) لعينات ZnO بحرارة تليدين 550, 750, 950 °C.

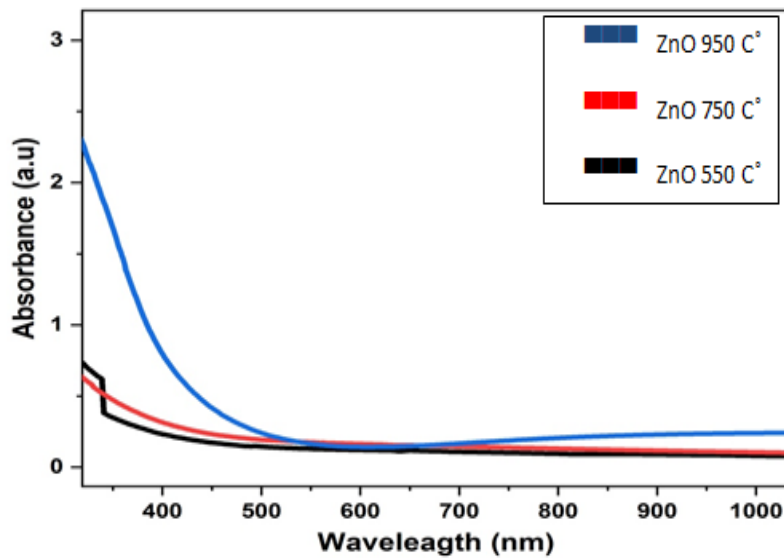
الجدول 2: يبين نتائج مجهر القوة الذرية (AFM)

معدل خشونة السطح	الجذر التربيعي لمتوسط الارتفاع	معدل الحجم الحبيبي	شرائح كوارتز
203.4nm	261.2nm	36.4nm	Annealing 550 °C ZnO
188.3nm	252.1nm	72.2nm	Annealing 750 °C ZnO
147.9nm	174.8nm	111.9nm	Annealing 950 °C ZnO

الخواص البصرية - الامتصاصية

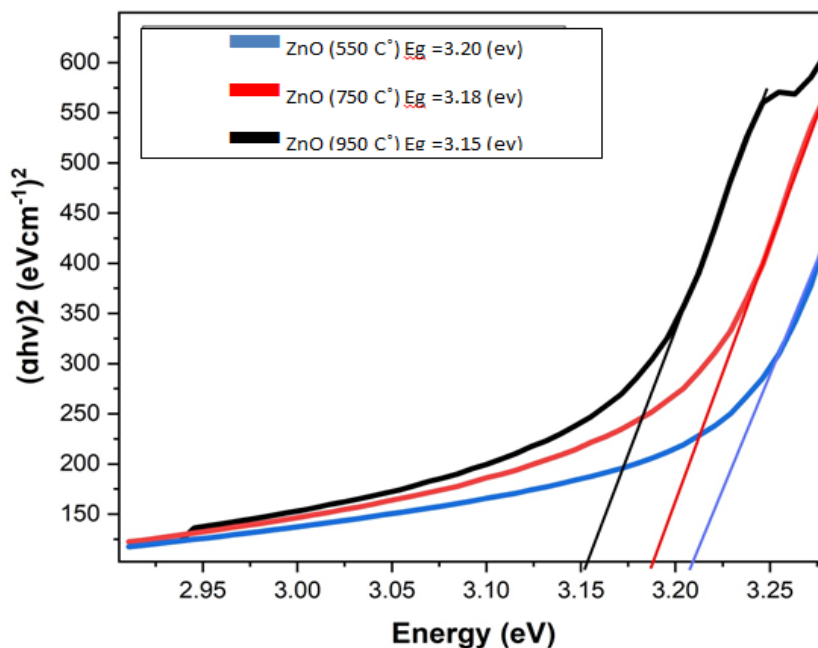
استخدم النطاق البصري (290-900) nm ووجد ان الامتصاصية تقل مع زيادة الطول الموجي، وان اعظم مقدار لقيمة الامتصاصية عند الاطوال الموجية القصيرة، وان هذا السلوك يفسر ان الاغشية تتميز بزيادة الامتصاصية عند الاطوال الاقل من 400 nm والتي تقع ضمن المنطقة فوق البنفسجية، حيث تعزى زيادة الامتصاصية مع زيادة درجة حرارة التليدين انتظام ترتيب الذرات الداخلي وانخفاض العيوب التركيبية أدت بالنتيجة الى تقليل المستوى الموضعي ويؤدي هذا الى انخفاض طاقة السطح للعينات، وان الاغشية التي لم يتم تليدينها لم تبين طيف امتصاصية لذا لم تدرج للمقارنة في نتائج هذا البحث. ويفسر هذا ان الامتصاصية تكون عند الاطوال الموجية الطويلة اقل ما يمكن وذلك لان طاقة الفوتون الساقط اقل من قيمة فجوة الطاقة لشبه

الموصل وهذا يتفق مع الدراسة [11]. والشكل (4) يوضح طيف الامتصاصية لمادة ZnO النانوية باختلاف درجات حرارة التلدين (550,750,950)C° على شرائح من الكوارتز.



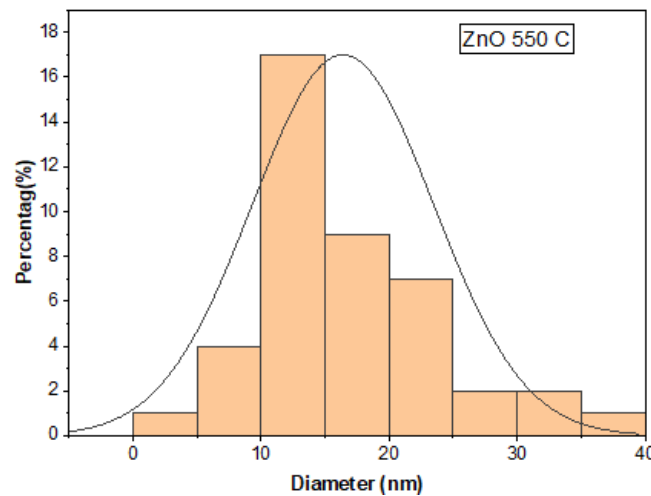
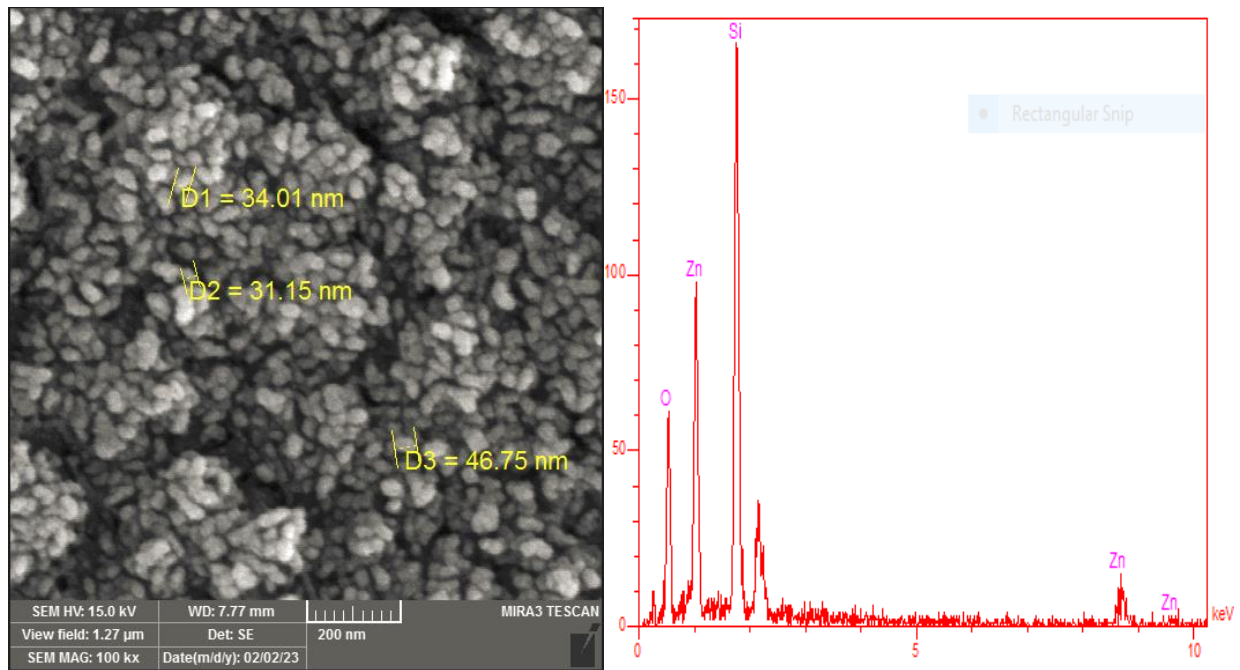
الشكل 4: يوضح تغير امتصاصية اوكسيد الخارصين مع تغير الطول الموجي بحرارة تلدين للعينات (550,750,950).

فجوة الطاقة: في حسابات النتائج يظهر لنا رقمياً فرق في فجوة الطاقة للعينات المملدة بدرجة مختلفة يبدو تغيراً طفيفاً وكأن مسار الميل قريب جداً من بعضهما وخصوصاً التلدين بحرارة 550)C° و 750)C° والسبب في ذلك لان ظروف التلدين بهذه الدرجات الحرارية قريب من بعضه كتأثير للحرارة، وان Energy gap المحصورة تعتمد على ترتيب وتوزيع الذرات في الشبكة البلورية للأغشية الرقيقة والبنية البلورية ، والشكل (5) يوضح قيمة طاقة الفجوة للعينات من اوكسيد الخارصين المُرسب على شرائح من الكوارتز بدرجات حرارة 550,750,950)C° بين $(\alpha h\nu)^2$ ev للمحور Y و $h\nu$ ev على محور X حيث يشير السهم الخطي الى طاقة الفجوة المباشرة للعيينة المستخدمة حيث وجد ان زيادة طاقة الفجوة مع زيادة درجة حرارة التلدين وتعليل ذلك الى زيادة التبلور للمادة وانخفاض العيوب البلورية ، لذلك تقل المستويات الموضعية قرب حزمي التكافؤ والتوصيل مما ادى الى زيادة قيمة طاقة الفجوة المحصورة. البحث [12].

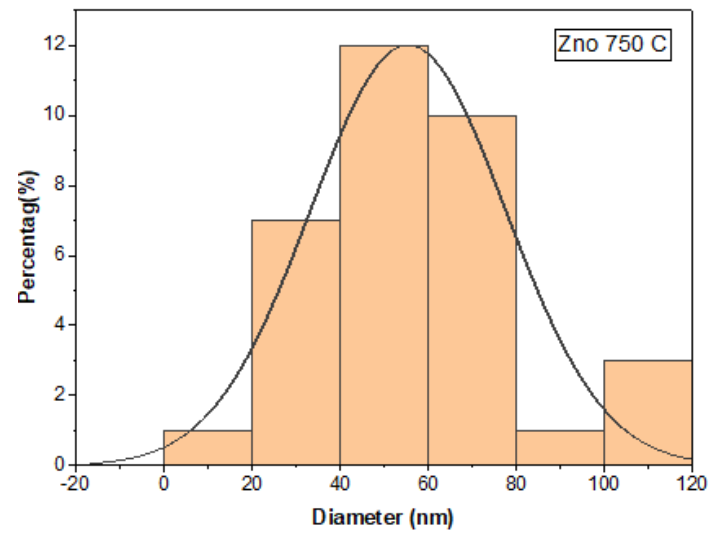
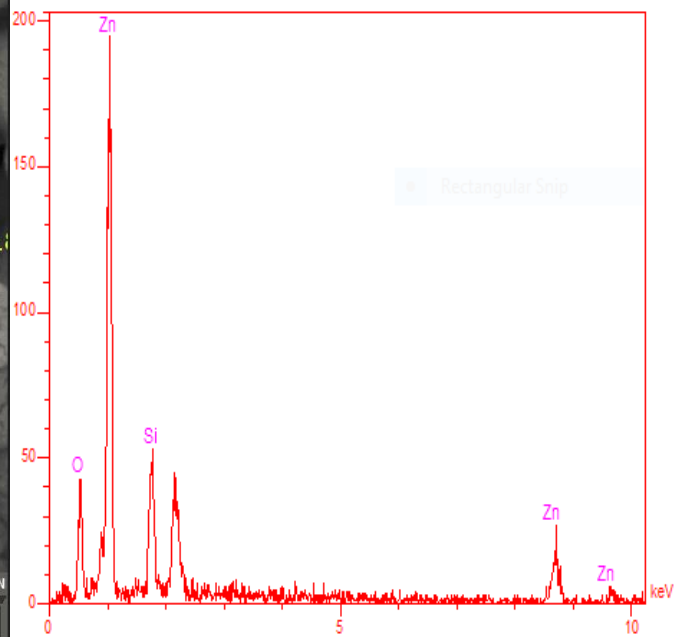
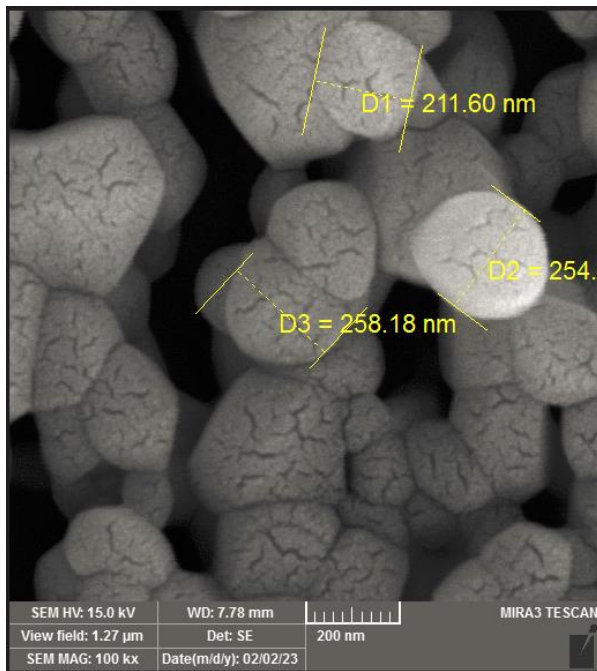


الشكل 5: تغير قيم فجوة الطاقة لمادة ZnO بدرجات حرارة تلدين 550,750,950) C° على قواعد من الكوارتز.

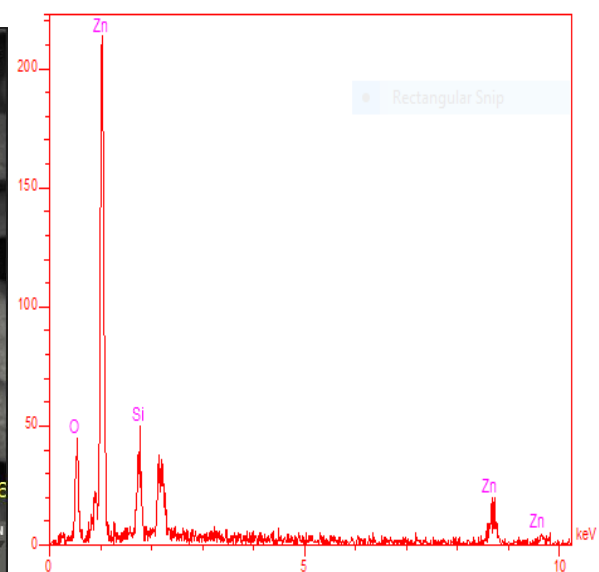
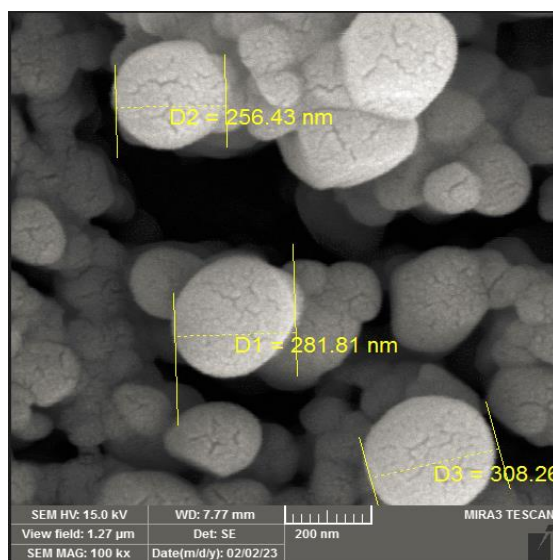
فحص المجهر الالكتروني الماسح: تم فحص العينات المرسب عليها ZnO بتقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD) باستخدام تقنية المجهر الالكتروني الماسح (SEM) وذلك للتعرف على طبيعة سطوح الاغشية ودراسة تغير الحجم الحبيبي (G.S) مع تغير درجة حرارة التلدين، من خلالها تبين ان زيادة درجة حرارة التلدين كان لها الدور في شكل السطح النهائي للتركيب السطحي للغشاء الرقيق، وتبين ان جميع الاغشية الرقيقة تمتلك حبيبات منتظمة التوزيع وبزيادة درجات حرارة التلدين تبين زيادة في الحجم الحبيبي [13] ونلاحظ من صور SEM اختفاء الشقوق والعيوب نتيجة للظروف التحضيرية للغشاء والتلدين بدرجة عالية، و الشكل (6, 7, 8) يوضح صوراً للمجهر الالكتروني الماسح ومخطط (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) EDX مطافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية وهي تقنية تحليلية تستخدم من أجل تحليل العناصر لمعرفة نوع العناصر الكيميائية وخصائصها للعينات، الذي يوضح العناصر التي يتكون منها الغشاء ومخطط التوزيع الحبيبي ويتبين ان معدل الحجم الحبيبي يتراوح بين (34-250)nm وهذه النتائج من فحص المجهر الماسح جاءت مطابقة تقريباً لما حصلنا عليه من فحص الحيود بالأشعة السينية باستخدام معادلة دي- باي شرر، وان توزيع القطر الحبيبي يزداد بزيادة حرارة التلدين والنتيجة مطابقة لما حصلنا عليه من صور مجهر القوة الذرية الذي تبين منه ايضاً ان جميع العينات كانت ذات تجانس كبير جداً مع سطح قواعد الكوارتز الاساس Quartz Substrate وبدون عيوب. ظهرت صور المجهر الالكتروني الماسح (SEM) لشرائح الكوارتز التي تم ترسيب ZnO عليها بتقنية بالليزر النبضي (PLD) وباختلاف درجات حرارة التلدين (550,750,950)C° ان العناصر التي تتشكل منها للعينات وكل القمم التي ظهرت ثلاثية الابعاد هي للزنك والاكسجين فقط . وتم اختيار صور ميكروية ذات قدرات تكبير ومقاييس نانوية موحدة وهي 200 nm.

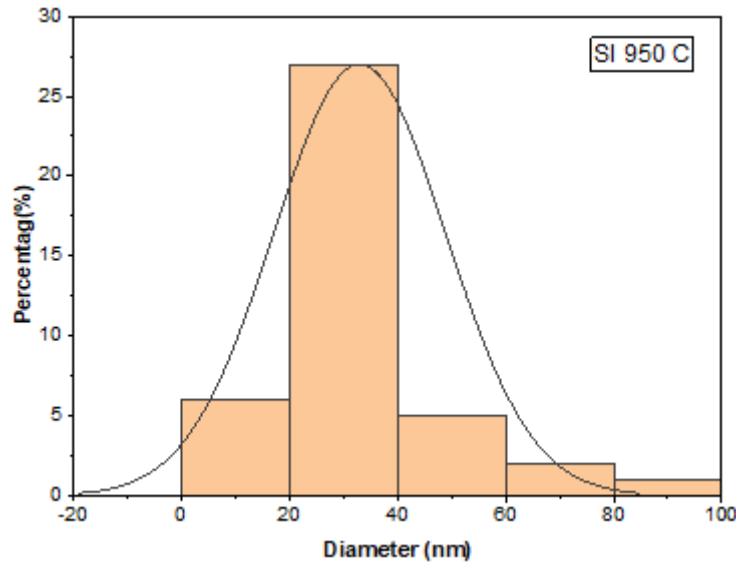


شكل 6: صور SEM وفحص EDX والتوزيع الحجمي النانوي لغشاء ZnO بدرجة حرارة تلدين 550 C°.



شكل 7: صور SEM وفحص EDX والتوزيع الحجمي النانوي لغشاء ZnO بدرجة تليدين 750 C°.





شكل 8: صور SEM وفحص EDX والتوزيع الحجمي النانوي لعشاء ZnO بدرجة تليدين 950 C°.

واظهرت عينات اوكسيد الخارصين غير الملدنة قيماً وقراءات عشوائية لم تُرفق مع النتائج من اجل مقارنتها مع درجات حرارة التليدين، وتم ذكر النماذج المُحضرة بدرجات حرارة التليدين وبالترتيب (550,750,950) C°.

الخصائص الكهربائية

فحص تأثير هول: تم تحليل ودراسة نتائج الفحوصات الكهربائية التي أجريت على العينات المُحضرة على الكوارتز من ZnO بتقنية PLD من خلال معرفة الصفات الكهربائية لشبة الموصل يتم معرفة مدى ملائمة لصناعة نبيطه الكترونيه مثل التوصيل الكهربائي وتركيز حاملات الشحنة ونوع تلك الحاملات، وهناك العديد من العوامل التي تعتمد عليها الخصائص الكهربائية في شبه الموصل متعدد البلورات مثل الحرارة والضوء وكثافة الذرات الشائبة والمجال المغناطيسي وتأثير درجة حرارة التليدين عليها، ان ظاهرة تأثير هول (Hall effect) لمعرفة نوع شبة الموصل ومقدار التوصيلية والمقاومية والتحركية لكل حرارة تليدين لأوكسيد الخارصين . تم حساب نتائج تأثير هول لشرائح الكوارتز التي تم ترسيب ZnO عليها بتقنية الترسيب بالليزر النبضي PLD وبدرجات حرارة تليدين 950, 750, 550 C° لفحص معامل هول والتوصيلية الكهربائية والتحركية الكهربائية وعدد حاملات الشحنة ونوعها، حيث أظهرت الفحوصات للنماذج المُحضرة ان معامل هول يقل بزيادة درجة حرارة التليدين وان أغشية اوكسيد الزنك جيدة في التوصيلية الكهربائية وتنتج هذه التوصيلية بسبب وجود ذرات Zn في المواقع التعويضية داخل الشبكة البلورية او بسبب فراغات O₂ مما يدل على ان ذرات الخارصين مانحة وهذا ما بينه ميل معامل هول السالب ويدل على ان شبه الموصل من النوع السالب (n-type) وان الناقلات هي الالكترونات، وهذه النتائج التي حصلنا عليها تتفق مع البحث [14]، وبحساب معامل هول والتوصيلية الكهربائية وتم حساب التحركية (μ_H) وحاملات الشحنة (n_H). وجد ايضاً ان التوصيلية و(μ_H) تزداد تدريجياً مع زيادة التليدين، ويوضح الجدول (3) يوضح نتائج فحوصات الخصائص الكهربائية حيث نلاحظ فيه تناسب مقدار التوصيلية مع زيادة حرارة التليدين .

جدول 3: يبين معامل هول والتوصيلية والتحركية وعدد الحاملات الحرة ونوعها لأغشية اوكسيد الخارصين بزيادة حرارة التليدين.

Sample	R _H (cm ³ /c)	σ(Ω.cm) ⁻¹	μ(Cm ² /v.se)	n(cm) ⁻³	Type
ZnO 950C°	-1.659E+6	4.851E-6	4.851E+0	-3.763E+12	n
ZnO 750C°	-5.113E+5	1.816E-5	2.461E+1	-5.991E+12	n
ZnO 550C°	-7.250E+6	1.702E-6	2.209E+1	-7.106E+12	n

في الخاتمة، تم دراسة وتحليل نتائج تأثير درجة حرارة التلدين على الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لأغشية أكسيد الخارصين ذات البنية النانوية المترسبة بتقنية الاستئصال بالليزر النبضي، حيث وجد أن خصائص هذه الأغشية حساسة لدرجة حرارة التلدين. حيث أصبح حجم الحبيبات أكبر وذات كثافة عالية. إن القياسات البصرية أظهرت لنا تأثير زيادة درجات حرارة التلدين على عينات مادة ZnO النانوية المترسبة على قواعد من الكوارتز أن الامتصاصية ومعامل الامتصاص تزداد مع زيادة حرارة التلدين وأن فجوة الطاقة البصرية تقل بزيادة حرارة التلدين، وبينت نتائج الخصائص التركيبية أن الحجم الحبيبي لأوكسيد الخارصين يزداد بزيادة حرارة التلدين الذي بينه فحص مجهر القوة الذرية AFM. وأظهرت نتائج فحص حيود الأشعة السينية XRD أن لمادة ZnO تركيباً سداسياً (Hexagonal) ذو بلورات متعددة، وأن له قمماً وزوايا حيود تطابق البطاقة العالمية (01-079-0206) وتزداد شدة القمم وحجم الحبيبات (G.S) بزيادة حرارة التلدين، وأظهر فحص SEM زيادة في حجم البلورات وأصبحت أكثر كثافة وبينت الصور اختفاء الشقوق والعيوب نتيجة للظروف التحضيرية للغشاء والتلدين بدرجة عالية، وتبين أن جميع الأغشية الرقيقة تمتلك حبيبات منتظمة التوزيع وبزيادة درجات حرارة التلدين نلاحظ زيادة في الحجم الحبيبي [15]. وبين فحص مطيافية التشتت بالأشعة السينية EDX أن التركيب الكيميائي للأغشية الرقيقة المحضرة كانت من Zn و O فقط. وتبين من فحص تأثير ظاهرة هول أن جميع الأغشية كانت من نوع (n-type) وأن معامل هول والتوصيلية الكهربائية تزداد بزيادة حرارة التلدين، وأن التحركية الكهربائية وعدد الحاملات يزداد أيضاً بزيادة درجات حرارة التلدين. وأن مواصفات الغشاء تحسنت بفعل التلدين مما يمكن استخدامه كمتحسس غازي ذو تحسسية أفضل وزمن استجابة أقل بفعل التلدين بدرجات حرارة عالية.

التشكرات

الشكر موصول لكل من قدم لنا الدعم في بحثنا هذا ونخص بالذكر:

جامعة بغداد / الجامعة التكنولوجية – بغداد / كلية العلوم – جامعة تكريت / جامعة تبريز – جمهورية إيران.

References

1. Hamida E. S., Hanaa A. A., & Mayes A.K. (2019). Adsorption Study Of the Interaction Between Zinc Oxide Nanoparticles with Albumin And Creatinine. College of Education for pure Science, University of Kerbala.
2. Noor, H. A., Mohamed, H., & Nehad, A. A. (2017). Preparation and Surface Modification of Zinc Oxide Nanoparticles. Journal of Babylon University, 25, 497503.
3. Chen, W. J., Liu, W.L., Hsieh, S. H., & Tsai, T. K. (2007). Preparation of nanosized ZnO using α brass. Applied Surface Science, 253(16), 6749-6753.
4. H.Salah Saaba , (2005) "study of the electrical and optical properties for GaSe₄, GeSe₄Te thin films" M.ScThesis university of Al-Mustansiriyah,
5. Te. Al.Aswad , (2010) "study the effect of Doping by cobalt on the some physics). Properties of (cds) thin films" M.Sc .Thesis university of Tikrit,.
6. R.Eason , (2007). "pulsed laser Deposition of thin films Application-led growth of function materials ",Johnwiley & sons,
7. C. Phipps(2007)." laser Ablation and its Application " ,New Maxico Springer
8. R.Lynn Johnson, (2012). "characterization of piezoelectric ZnO thin films an the Fabrication of piezoelectric micro-cantilevers", M.Se, thesis, Iowa state university of Tikret,
9. A. H.Omran Alkhayattl , I.A.Dishar Al-hessians ,O.A. chichan Alrikaby (2014). "Annealing Effect on the Structural and Optical Properties of sol-gel Deposited Nanocrystalline CdO Thin Films" Vol.34,
10. P.Sagar , M.Kumar ,R.M. Mehra (2005) "Electrical and optical properties of sol- Gel derived ZnO-Al thin films "Materials science –poland , 23.3. 685-696.

11. Nur.A.S. Yap, W.F. and khamirul .A.M. (2017). "Europium doped Low cost Zn_2So_4 based glass ceramics : A study on fabrication , structural energy Band gup and lumineseeence properties" , Materials science in semiconduc- Tor processing , 61 :27-34 ,
12. D. Lin-Vien, (1991). "The Handbook of Infrared and Raman Characteristic Freq- uencies of Organic Molecules
13. Ali, H. M., & Hakeem, A. M. A. (2015). Characterization of n and p-type $(\text{SnO}_2)_x (\text{ZnO})_{1-x}$ nanoparticles thin films. The European Physical Journal Applied Physics, 72(1) , 10301.
14. Z. Bi-Ju, LIAN Jian-She, Zhao Lei, Jiang Qing (2008) "Optical and Electrical Properties of ZnO/CdO Composite Thin Films Prepared by Pulse Laser Deposition" Chin. Phys. Lett., 1, 016801.
15. Ali, H. M., & Hakeem, A. M. A. (2015). Characterization of n and p-type $(\text{SnO}_2)_x (\text{ZnO})_{1-x}$ nanoparticles thin films. The European Physical Journal Applied Physics, 72(1) , 10301.

Effect of annealing temperature on the optical, structural and electrical properties of Zinc oxide films Nanoparticales deposited by pulsed laser deposition

Othman M. Talib*, Kasim H. Mahmoud

Department of Physics, College of Education for Pure Sciences, Tikrit University, Iraq

Article Information

Received: 27/03/2023

Accepted: 30/04/2023

Keywords:

Oxides, Deposition (PLD),
Quartz slides, Thin films,
Annealing

Corresponding Author

E-mail:

Abstract

Were prepared nanoparticles of zinc oxide (Zno) using the pulsed laser deposition (PLD) technology. The sedimentation of the membrane occurred during the interaction between the incident laser beams with the atoms of the target material, than a plasma state was formed inside the sedimentation chamber upward towards the bases of deposited installed higher than the disk (target), with distance of 20 mm, and a vacuum pressure of (10^{-3}) mbar. The films are deposited and grow on the surface of the quartz base so that the distance between the target material and the laser beams is 150 mm, and with different annealing temperatures (550,750,950) C °and with a time of two hours on the quartz slides. The effect of changing the annealing temperatures was studied on the structural, surface topography, optical and electrical properties using UV,SIM,AFM,XRD measuring devices for the purpose of knowing the nature of the surface of the surface of the prepared film and observing the change in particle size with increasing annealing temperature after deposition. It was found that the average partial size is 42.16nm, and the preferential orientation along the surface along the surface is (200), and the energy gap decreases with increasing annealing temperature to become (3.15)ev at annealing temperature 950 C°. And that the absorbance increase with increasing annealing temperature, The results of scanning electron microscopy shows that the particle size increases with the increase in the annealing temperature that the structures are all nanoparticle. The hall effect phenomenon for the samples from kind of (n-type) and the conductivity, hall coefficient and electrical mobility with the increase in the annealing temperature.